

Интернет-семинар **«Усовершенствованный спектрометр электрической подвижности SMPS для контроля частиц с диаметром от 1 нм. Быстрое сканирование частиц»** состоялся 20 октября 2016 года.

На семинаре было рассказано о новой модели спектрометра SMPS, позволяющей контролировать частицы с диаметром от 1 нм, и о возможности модернизации ранее выпущенных спектрометров SMPS до уровня SMPS 1 нм.

Семинар прошел при участии специалиста Европейского офиса компании TSI Люции Бустин.

Получить материалы семинара можно, направив запрос по электронной почте esm-optec@peterlink.ru.

В заявке необходимо указать наименование организации, ФИО и контактные данные участника, название интересующего семинара.